

プロトタイプデバイス試作評価サービス

あなたのニーズに試作から評価までワンストップ対応します！

このようなニーズ、お困り事はありませんか？

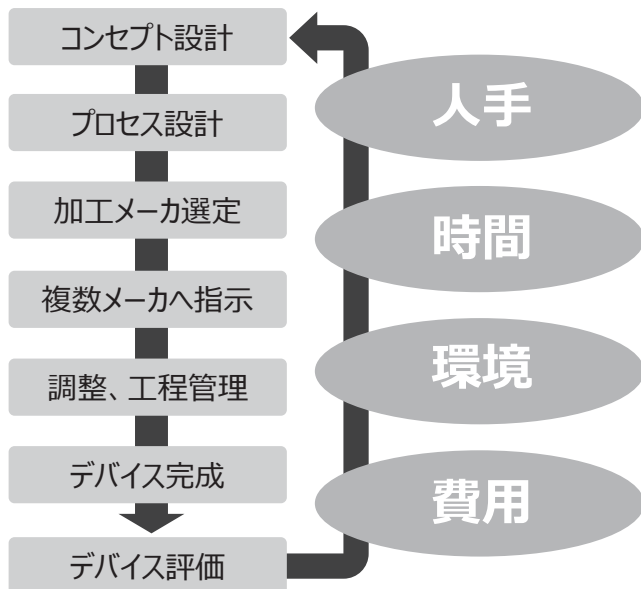
ニーズ
お困り事
(例)

- 概念実証) 新コンセプトデバイスのPoCをしたい。どこで作って評価しよう…？
- 論文追試) この論文の内容に興味があるけど、どうやって追試したらいいの…？
- 材料評価) 新しい半導体用新材料をデバイス化して評価したいけど環境がない…



デバイスのコンセプト設計から具現化、評価までのトータルサポートをご提案

デバイス具現化～評価に必要な一般的ステップ



KRI

One Stop Service



知識・経験・実績

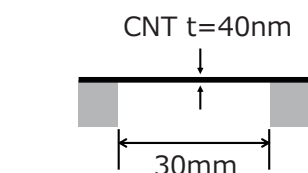
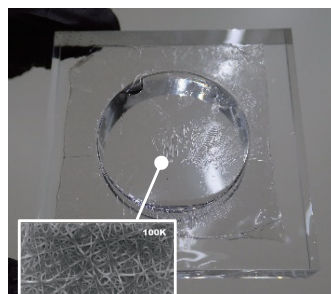
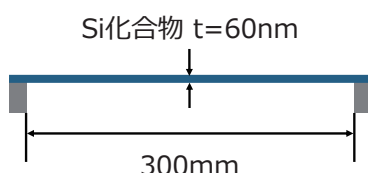
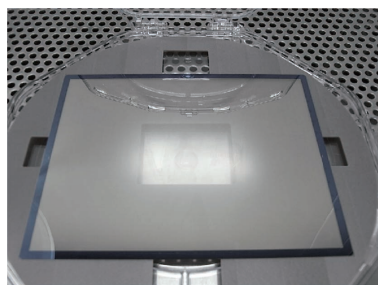
加工ネットワーク

スケジュール管理

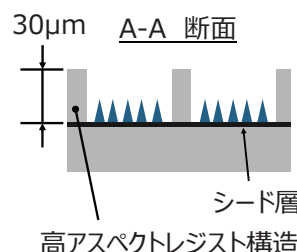
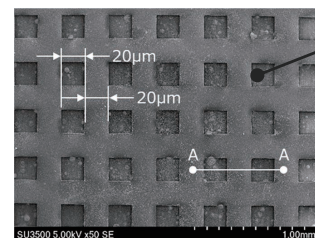
デバイス試作評価

ワンストップでデバイスを具現化・評価

事例1. nmオーダーの極薄自立膜構造体 (Si化合物、CNT)



事例2. 高アスペクトレジスト構造+ナノ構造形成



ナノ構造形成 形状例

